Nd 下地層を施した Si 基板への Nd-Fe-B 系磁石膜の成膜

竹馬 雄*,山下 昂洋,柳井 武志,中野 正基,福永 博俊 (長崎大学) Nd-Fe-B film magnets deposited on Si substrates with Nd under-layer

Y. Chikuba, A. Yamashita, T. Yanai, M. Nakano and H. Fukunaga (Nagasaki University)

1. はじめに スパッタリング法を用いた Si 基坂上への Nd-Fe-B 系磁石膜の作製が報告される中⁽¹⁾⁽²⁾, 我々は PLD(Pulsed Laser Deposition)法を用い, 熟酸化膜付き Si 基板 上に 15 at. %以上の Nd を含有する等方性 Nd-Fe-B 系磁石膜 を成膜することにより, 試料の破壊(膜の剥離や基板の破壊)を抑制し, 150 µm 程度までの厚膜化を実現してきた⁽²⁾。しかしながら,上記の化学量論組成を大幅に超える Nd 含有量は, 保磁力を向上させる一方, 残留磁気分極や(BH)max の 低下を招く。最近, その Nd 含有量を多く含む試料の微細構 造を断面観察したところ, Si 基板と Nd-Fe-B 系磁石膜の界 面に厚さ 1 µm 程度 の Nd 層が析出する事が確認され, Si 基板と Nd₂Fe₁₄B 相の中間の線膨張係数値を有する Nd 元素 の層が, 試料の破壊現象を防ぐ一つの要因と推察される。

本研究では、磁石膜とSi基板の界面に1 µm 厚以上の4 種類の厚みのNd下地層を設け、その下地層の上にNd₂Fe₁₄B とほぼ同じ組成の磁石膜を作製する手法を試み、Si基板上 の等方性Nd-Fe-B系磁石膜の磁気特性向上を検討した。

2. 実験条件 本実験では真空度 2.0 ~ 8.0×10⁻⁵ Pa 程度の チャンバー内で回転するターゲットに,Nd-YAG パルスレ ーザを照射することで,対面に設置した(100)単結晶 Si 基板 に堆積させた。①下地層形成のための Nd 単体ターゲット, ならびに②磁石膜を成膜するための Nd2Fe14B 合金ターゲッ トの 2 種類のターゲットを自公転ターゲットホルダーに設 置した。Nd 下地層の厚みは,成膜速度より 1,3,3.5,5 µm の4 水準の厚みに制御した。レーザパワーを4 W,ターゲ ットと基板間の距離を 10 mm に固定し,成膜直後のアモル ファス状態の試料を保持時間約 3.5 sec のパルス熱処理に より,Nd2Fe14B 相を形成した。磁気特性の測定は VSM,膜 組成の評価と表面観察には SEM(EDX 機能付き)を用いた。

3. 実験結果 Fig.1 は, 各厚みの Nd 下地層の上に, Nd-Fe-B 系磁石膜を成膜し、熱処理後に「Si 基板からの磁 石膜の剥離」や「Si 基板自体の破壊」等が生じなかった試 料に関して,膜厚と組成の関係を示したものである。縦軸 の Nd 含有量は、Nd 下地層の上に Nd-Fe-B 膜を堆積した後 の as-depo 試料において評価したものであり、10 µm 以上の Nd-Fe-B 膜の厚みを鑑みると下地層が組成評価へ及ぼす影 響は少ないものと判断した。更に, Fig.中の横線は Nd2Fe14B の化学量論組成付近の Nd 含有量を示すものである。Nd 下 地層の厚みの増加に伴い、得られる磁石膜の最大膜厚が増 加する傾向が観察される。例えば、Nd下地層の厚みを5µm まで増加すると、Nd-Fe-B 系磁石膜の膜厚は最大で 60 μm 程度まで向上できることが明らかとなった。既報の Nd 下地 層を施さずにNd₂Fe₁₄B組成付近の試料をSi基板上に直接成 膜した際に、機械的破壊が生じず再現性良く得られた試料 の膜厚は最大で 10 µm 程度⁽²⁾であり、本実験では、同程度 のNd含有量のNd-Fe-B系磁石膜に対し、Nd下地層を用い ることで大幅にその膜厚が増加できる事を明らかにした。

その一方で、Fig.1の実験においては、試料の破壊現象も

ー部観察された。例えば、Nd 下地層の1もしくは3 µmの 薄い下地層を施した際、Nd-Fe-B 系磁石膜の厚みが 30 µm の範囲において、Si 基板内部からの破壊が生じる現象が一 部見られた。これは、短時間の成膜により島状の下地層が 形成され、Si 基板上に直接 Nd-Fe-B 系磁石膜が成膜された 箇所が一部生じ、応力緩和が不十分な箇所が生じたためと 考えられる。加えて、Nd 下地層の厚みを5 µm とした際、 60 µm までの厚膜化を達成した一方、20 µm 程度の薄い Nd-Fe-B 系磁石膜において、基板から Nd-Fe-B 系磁石膜が 剥離する現象が一部見られた。この結果は、既報の自然に 形成された Nd 層⁽²⁾と本実験での人工的に作製した Nd 下地 層では、基板と試料の界面に働く密着力に果たす役割が異 なることを示唆している。以上の再現性の問題を鑑みて、 発表迄に Fig.1 に関しデータの積み重ねを行う予定である。

Fig.1 において,最も厚い磁石膜の試料(Nd 下地層:5 μm) の減磁曲線(実線)を Fig.2 に示す。ここでは,従来の手法で ある Si 基板に Nd 下地層なしで直接成膜したほぼ同程度の 膜厚を有する Nd-Fe-B 系磁石膜を併せて記載する(破線)。た だし,その試料の Nd 含有量は約23 at.%である。Nd 下地層 を用いることで,60 μm 程度の厚みの試料において,Nd 含 有量を大幅に低減でき,残留磁気分極と(*BH*)max を向上でき た。今後,下地層に Nd リッチな Nd-Fe-B 膜も検討する。



Fig.1 Nd-Fe-B film magnets deposited on Nd under-layers with various thickness.



Fig. 2 Demagnetization curves of Nd-Fe-B films deposited on Si substrates with Nd under-layer or without Nd under-layer.

文献 (1)小峠ら,電気学会マグネティクス研究会資料, MAG-12-170(2012). (2) M. Nakano *et. al., IEEE Trans. Magn.* **51**, #2102604(2015).